**Тамбовский Михаил Анатольевич. Радиоспектроскопический метод и СВЧ спектрометр для неразрушающего контроля электронных поверхностных состояний металлов и полупроводников : дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 Казань, 2006 110 с. РГБ ОД, 61:07-5/1758**